

# 第72 回応用物理学会春季学術講演会にて ランチョンセミナーを開催します!!

コラボレーション  
セミナー

- 2025年3月14日(金)
- 12:10~12:50
- K207

## 演題

座標共有システム nanoGPS を活用した  
同一箇所での効率的な XPS および Raman データの収集

## スピーカー

アルバック・ファイ株式会社 橋本 真希  
株式会社堀場テクノサービス 岡 祥司



XPS

走査型X線光電子分光分析装置  
PHI GENESIS



Nano-GPS



Raman

ラマン顕微鏡  
XploRA™ PLUS

パターンウェハや電子基板、インクジェットノズル、ディスプレイなどの繰り返し構造を持つ試料、または多数の同形状の試料を測定する際、測定箇所の正確な特定は非常に重要です。しかし、複数の装置を使用する場合、その精度を維持するのは容易ではありません。そこで、座標共有システム「nanoGPS」を活用して、同一箇所から高精度で効率的に XPS および Raman データの収集を実現しました。本セミナーでは、最新の手法をご紹介します。

アルバック・ファイ株式会社、株式会社堀場テクノサービス、株式会社堀場製作所はお客様の氏名、会社名、メールアドレス、その他、本学会に関して入力いただいた項目及び名刺交換等により取得した項目を共同利用いたします。アルバック・ファイ株式会社、株式会社堀場テクノサービス、株式会社堀場製作所は、それぞれのプライバシーポリシーの範囲内でそれぞれの製品・サービスに関する情報をお客様に提供させていただく場合に、上記を利用いたします。

アルバック・ファイ株式会社

〒253-8522 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2500



株式会社堀場テクノサービス

〒601-8305 京都市南区吉祥院宮の東 2

